



ContourX-100 三维光学轮廓仪

● 直观经济的台式粗糙度计量设备

ContourX-100光学轮廓仪以最佳的价格为准确和可重复的非接触式表面计量树立了新的标杆。

该小尺寸系统采用流线型设计，结合了数十年专有的布鲁克白光干涉仪 (WLI) 创新，可提供毫不逊色的2D / 3D高分辨率测量功能。满足计量要求的台式系统具有业界最先进的友好用户界面，可直观访问多种预编程滤镜和分析工具，用于精密加工的表面，薄膜和摩擦学应用分析。

新一代增强功能包括新的五百万像素摄像头，新的载物台和新的测量模式，提供了更大的灵活性。ContourX-100光学轮廓仪是一台极有价值的计量设备。

快速、可重复的三维计量

- 与放大倍率无关的业界最好Z轴分辨率
- 最大尺寸的标准视场
- 最高稳定性和重复性的集成防震设计

卓越的测量和分析功能

- 易于使用的界面，可快速准确地获得结果
- 最广泛的滤镜和分析工具选项，用于粗糙度和关键尺寸测量分析
- 满足包括ISO 25178, ASME B46.1, ISO 4287等标准在内的定制化分析报告

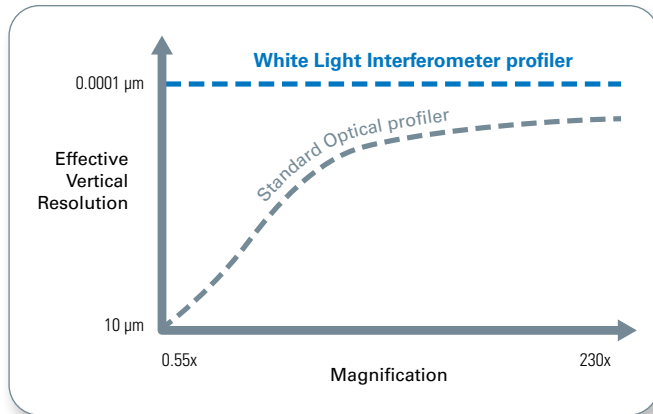
先进的计量功能

ContourX-100轮廓仪是布鲁克在非接触表面计量、表征和成像领域超过四十年的专有光学创新和作为行业领导者的结晶。该系统结合三维白光干涉和二维成像技术在单次测量中实现多种分析。

ContourX-100对于反射率从0.05%到100%的各种表面都非常易于测量。

无与伦比的分析与回报

通过上千项自定义分析功能和简易但功能强大的VisionXpress™和Vision64®用户界面, ContourX-100为提高实验室和工厂车间的生产率进行了优化。这种独特的硬件和软件组合提供了对高重复性和高通量计量学测量的便捷访问,完全超过了同类计量技术。



白光干涉仪提供了最好的与放大倍数无关的垂直分辨率。



ContourX-100手动样品台。

ContourX-100 Specifications

| | |
|----------------------|---|
| 最大扫描量程 | ≤10 mm |
| 垂直分辨率 ¹ | <0.01 nm |
| 水平分辨率 | 0.38 μm min (Sparrow criterion); 0.13 μm (with AcuityXR [®]) |
| 台阶高度准确性 ² | <0.75% |
| 台阶高度重复性 | <0.1% 1 sigma repeatability |
| 最大扫描速度 | 37 μm/sec (with standard camera) |
| 样品反射率范围 | 0.05% to 100% |
| 最大样品倾角 | ≤40° (shiny surfaces); ≤87° (rough surfaces) |
| 样品高度 | ≤100 mm (4 in.) |
| XY 样品台 | 150 mm (6 in.) manual stage |
| Z 轴聚焦 | 100 mm (4 in.) |
| 倾斜功能 | ±6° available on stage |
| 光学计量模块 | Patented dual-color LED illumination; Single-objective adapter; Optional automated or manual turret; Optional motorized or manual discrete modules |
| 物镜 | Parfocal: 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X, 115X; LW: 1X, 1.5X, 2X, 5X, 10X; TTM: 2X, 5X, 10X, 20X; Bright Field: 2.5X, w5X, 10X, 50X |
| 放大器 | 0.55, 0.75X, 1X, 1.5X, 2X |
| 摄像头 | Monochrome (standard) or color (optional); 5 MP with 1200x1000 data array |
| 软件系统 | Vision64 and VisionXpress Analysis Software on Windows 10 OS; 64-bit |
| 可选软件包 | USI; Advanced PSI; Production Mode; VisionMAP; AcuityXR [®] ; Optical Analysis; SureVision; Film; MATLAB; SDK, TCP/IP |
| 自动测量功能 | Auto intensity; auto focus; auto-saving, on-fly analysis; recording in database |
| 校准 | Via NIST/PTB traceable step height and lateral ruler standards |
| 设备尺寸 | 451 mm (W) x 533 mm (D) x 754 mm (H) |
| 重量 | 60 kg |
| 保修期 | 12 months |

¹ SiC 标样上重复30次PSI模式测量的标准偏差。

² 采用8 μm以上台阶标样。

● 布鲁克纳米表面计量部

北京办公室 电话: 010-58333257

上海办公室 电话: 021-5172081

广州办公室 电话: 020-22365885

客户服务热线: 400-890-5666

邮箱: BNS.China@bruker.com

网址: www.bruker.com/nano

www.bruker.com/ContourX-100

